

Вспомогательные модули

Описание

Вспомогательные модули для тестирования и проверки работоспособности периферийных устройств DIMM-модуль цифровой сканирования (Digital I/O Scan DIOS) и модуль тестирования разъемов (Socket Test Module, STM). DIOS-модуль увеличивает покрытие стандартными 168-контактными разъемами DIMM и могут работать при различных уровнях напряжения и тактовой частоты (до 45 МГц). В некоторых DIOS-модулях, которые являются дополнительными ресурсами, поддерживающими периферийное сканирование, и использовать их для расширенного функционального тестирования. DIMM-модуль, например, можно использовать для

тестирования через краевые разъемы платы, получая доступ к несканируемым компонентам. Вы можете оценить контактных разъемов на проверяемой плате. Имеются STM-преимущества использования дополнительных модулей с модули с количеством контактов от 100 до 300, включая, помощью утилиты оценки тестового покрытия, входящей в несколько внешних выводов. состав пакета JTAG ProVision.